

---

## 編集後記

---

JSA の 23 巻 1 号をお届けします。

技術記事では、レーザー脱離イオン化イメージング質量分析法の表面分析法としての検討(解説)、有機物試料を FIB 断面作成後に GCIB クリーニングして TOF-SIMS で分析した速報、めっき腐食生成物の XAFS 評価の技術報告を掲載しました。

巻頭言を中村誠さんに、昨年の ECASIA の参加報

告を島政英さんに寄稿いただきました。

また、JSA 技術記事の J-STAGE への掲載の再開と、チューター制度の本格的始動について編集委員長から紹介しました。表面分析技術の向上を目指す SASJ への参加と、本誌への積極的な投稿をお願いします。(真田)

---

## JSA Journal of Surface Analysis

---

JSA 編集委員会 jsa@sasj.jp 電話:0467-85-4220 / Tel: +81-467-85-4220

編集委員長: 真田 則明 (アルバック・ファイ)

編集理事: 佐藤 美知子 (富士通クオリティ・ラボ)

編集委員: 阿部 芳巳 (MCHC R&D シナジーセンター), 伊藤 博人 (コニカミノルタ),  
井上 雅彦 (摂南大学), 大友 晋哉 (古河電気工業),  
大村 和世 (東北大学), 木村 昌弘 (JX 金属),  
熊谷 和博 (産業技術総合研究所), 鈴木 峰晴 (筑波大学),  
田沼 繁夫 (物質・材料研究機構), 當麻 肇 (日産アーク),  
永富 隆清 (旭化成), 橋本 哲 (JFE テクノリサーチ),  
吉川 英樹 (物質・材料研究機構), 吉原 一紘 (シエンタ オミクロン)

---

### SASJ: International Advisory Board

J. T. Grant (University of Dayton, USA)

H. J. Kang (Chungbuk National University, Korea)

S. Hofmann (Max-Planck-Institute for Metals Research, Germany)

A. Jablonski (Institute of Physical Chemistry, Poland)

C. J. Powell (National Institute of Standards and Technology, USA)

M. P. Seah (National Physical Laboratory, UK)

Y. C. Ling (National Tsing Hua University, Taiwan)

---

### Journal of Surface Analysis Vol. 23, No.1

編集・発行: 一般社団法人表面分析研究会

<http://www.sasj.jp/>

2016 年 10 月 07 日 印刷

2016 年 10 月 12 日 発行

発行所: 〒108-0074 東京都港区高輪 3-6-7

一般社団法人表面分析研究会

電話: 03-3473-6878 FAX: 03-3473-6862

Printed: October 07, 2016

Published: October 12, 2016

Published by

The Surface Analysis Society of Japan

Takanawa 3-6-7, Minato-ku, Tokyo 108-0074

Tel: +81-3-3473-6878 Fax: +81-3-3473-6862